

巻頭言	ナノサイエンスからナノテクノロジーへ (筑波大/山部紀久夫)	1
研 究	界面を非破壊で見る先端分析技術	
	実験から見た界面分析の技術展開 (物材機構, JASRI/小林啓介)	3
	理論から見た界面分析の基礎過程 (千葉大/中山隆史)	10
	光電子分光による有機薄膜の配向・界面電子状態解析 (千葉大/上野信雄)	20
	走査電子顕微鏡による埋もれた構造体の観察 (NTT/永瀬雅夫)	31
	放射光 X 線回折による埋め込み酸化膜の構造解析 (大阪大/志村考功)	41
最新技術情報	シリコン酸化膜 (東北大/高桑雄二)	51
談話室	研究室紹介	
	(産総研 エレクトロニクス研究部門 先端デバイス材料グループ)	75
	坂本統徳氏を偲ぶ	77
掲示板		
	研究会概要報告	
	・ 走査型プローブ顕微鏡 (20) (ICSPM14)	78
	・ 第 7 回 「イオンビームによる表面界面解析」 特別研究会	79
	・ 「表面・ナノ科学シンポジウム 2007」 (SSNS' 07)	80
	・ 第 12 回 ゲートスタック研究会	82
	開催案内	
	・ 第 35 回 薄膜・表面物理セミナー (2007)	83
	・ 9th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-9)	84
	議事録	
	第 35 期第 4 回 常任幹事会議事抄録	86
	第 35 期第 3 回 幹事会議事抄録	88
	第 35 期第 5 回 常任幹事会議事抄録	89
	第 36-37 期 幹事選挙結果報告	91
会 告	ニュースレター投稿規定	92
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 第 35 期常任幹事名簿	93
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 会員数、賛助会社名簿	94
編集後記		95

*分科会会員はホームページ (<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>) からカラー版PDFファイルをダウンロードする事ができます。(メーリングリストでお知らせのパスワードが必要です)

表紙写真：埋込 Si 構造の SEM 像
(永瀬氏提供, 詳しくは本誌 38 ページ参照)